

Метрология и стандартизация в нанотехнологиях и nanoиндустрии. 3-я школа.

Программа школы

Л1. МИРОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ. Мальцев Петр Павлович (д.т.н., профессор, директор, Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН, Москва)

[Презентация](#)

Л2. ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ В НАНОМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ. Латышев Александр Васильевич (чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., зам. директора по научной работе, Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск)

[Презентация](#)

Л3. РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ НАНОИНДУСТРИИ. Тодуа Павел Андреевич (д.ф.-м.н., профессор, генеральный директор, Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума, Москва)

[Презентация](#)

Л4. СКАНИРУЮЩАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ СТРУКТУР ОБЪЕКТОВ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ. Быков Виктор Александрович (д.т.н., генеральный директор ЗАО «НТ-МДТ», Зеленоград)

[Презентация](#)

Л5. КРЕМНИЕВАЯ НАНОЭЛЕКТРОНИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. Орликовский Александр Александрович (Академик РАН, директор, Физико-технологический институт РАН, Москва)

[Презентация](#)

Л6. ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ СТРУКТУР УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ. Киселев Николай Андреевич (чл.-корр. РАН, д.б.н., зав. отделом электронной кристаллографии, Институт кристаллографии РАН, Москва)

[Презентация](#)

Л7. ТЕХНОЛОГИЯ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ПРИБОРОВ НА ОСНОВЕ НАНОСТРУКТУР АЗВ5. Максимов Иван Александрович (Tekn Lic, PhD, заведующий лабораторией, Lund University, Лунд, Швеция)

[Презентация](#)

Л8. ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ АТОМНОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СИСТЕМ МЕТОДАМИ ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ. *Гутаковский Антон Константинович (к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск)*
[Презентация](#)

Л9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНХРОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОСТРУКТУР. *Аневский Сергей Иосифович (д.т.н., начальник научно-исследовательского отделения, ФГУП «ВНИИОФИ», Москва)*
[Презентация](#)

Л10. ЭЛЕКТРОННО- И ИОННО-ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В МЕТРОЛОГИИ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР В НАНОЭЛЕКТРОНИКЕ И МИКРОМЕХАНИКЕ. *Шкловер Владимир Яковлевич (директор, ООО «Системы для микроскопии и анализа», Москва)*
[Презентация](#)

Л11. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРЫ ДЛЯ МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ: СИНТЕЗ И ДИАГНОСТИКА. *Егоров Антон Юрьевич (к.ф.-м.н., зам. директора центра нанотехнологий, Санкт-Петербургский Академический университет - научно-образовательный центр нанотехнологий РАН, Санкт-Петербург)*
[Презентация](#)

Л12. ОТ НАНОТРАНЗИСТОРА К КВАНТОВЫМ ВЫЧИСЛЕНИЯМ. *Вьюрков Владимир Владимирович (к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, Физико-технологический институт РАН, Москва)*
[Презентация](#)

Л13. ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ В НАНОЭЛЕКТРОНИКЕ *Боргардт Николай Иванович (д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой, Московский государственный институт электронной техники, Москва)*
[Презентация](#)

Л14. АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ НАНОКРИСТАЛЛОВ ПО ДАННЫМ СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА. *Володин Владимир Алексеевич (к.ф.-м.н., доцент, с.н.с., Институт физики полупроводников СО*

Л15. О СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ. Коломенская Наталья Георгиевна (зам. генерального директора по научной работе, ОАО «РНИИ «Электронстандарт», Санкт-Петербург)

[Презентация](#)

Л16. ОРГАНИЧЕСКАЯ ФОТОВОЛЬТАИКА - ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Разумов Владимир Федорович (чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., председатель Научного центра РАН в Черногловке, зам. директора по научной работе, Институт проблем химической физики РАН, Черногловка)

[Презентация](#)

Л17. СТРУКТУРА И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАССИВА Si/Ge КВАНТОВЫХ ТОЧЕК. Захаров Николай Дмитриевич (к.ф.-м.н., научный сотрудник, Max-Planck Institute of Microstructure Physics, Германия)

[Презентация](#)

Л18. МЕТРОЛОГИЯ УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДОВ. Стахарный Сергей Алексеевич (начальник отдела метрологии устройств на основе органических светодиодов, ОАО «ЦНИИ «Циклон», Москва)

[Презентация](#)

Л19. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ОПТИЧЕСКИХ И ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ. Левин Геннадий Генрихович (д.т.н., профессор, руководитель научно-исследовательского отделения, ФГУП «ВНИИОФИ», Москва)

[Презентация](#)

Л20. О СОСТОЯНИИ РАЗРАБОТОК И НАЛИЧИИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ НАНОМАТЕРИАЛОВ. Остапук Людмила Павловна (эксперт-метролог, ФГУП «УНИИМ», Екатеринбург)

[Презентация](#)

Л21. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ. Корнеев Дмитрий Владиславович

(начальник отдела ФГУП «ВНИИМС», Москва)

[Презентация](#)

Л22. ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В НАНОМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ. *Голубев Сергей Сергеевич (к.т.н., с.н.с., ФГУП «ВНИИМС», Москва)*

[Презентация](#)

Л23. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ СВЕТОДИОДОВ В МИРЕ И В РОССИИ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. *Юнович Александр Эммануилович (д.ф.-м.н., профессор, Физический факультет МГУ, Москва)*

[Презентация](#)

Л24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ И КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ (ЦВЕТОВЫХ) ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДОВ. *Саприцкий Виктор Ильич (д.т.н., проф., руководитель Научно-исследовательского отделения ФГУП «ВНИИОФИ», Москва)*

[Презентация](#)

Л25. ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СВЕТОДИОДНЫХ СТРУКТУР С МНОЖЕСТВЕННЫМИ КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ InGaN/GaN И ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕГРАДАЦИИ В ТАКИХ СТРУКТУРАХ. *Якимов Евгений Борисович (д.ф.-м.н., зав. лабораторией, Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, Черноголовка)*

[Презентация](#)

Л26. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. *Долин Евгений Владимирович (зав. лаб. полупроводниковой светотехники, Научно-технологический центр уникального приборостроения РАН, Москва)*

[Презентация](#)

Л27. О РАБОТАХ ИЦ ООО «ВНИСИ» В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА. *Беляев Роман Иванович (научный сотрудник Испытательного центра, Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский светотехнический институт им. С.И. Вавилова, Москва)*

[Презентация](#)

Л28. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАНОФОТОНИКИ ВИДИМОГО И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ДИАПАЗОНА. *Грузинцев Александр Николаевич (д.ф.-м.н., зав. лабораторией, Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН, Черноголовка)*

[Презентация](#)

Л29. СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ ВТСП – ЛЕНТЫ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ В АСПЕКТЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И МЕТРОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА. *Кауль Андрей Рафаилович (д.х.н., проф., зав. кафедрой, Химический факультет МГУ, Москва)*

[Презентация](#)

Л30. МЕТРОЛОГИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ СВОЙСТВ НОВЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. *Руднев Игорь Анатольевич (к.ф.-м.н., доцент, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва)*

[Презентация](#)

Л31. АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И МЕТРОЛОГИЯ ВЫСОКОЧИСТЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ. *Карнов Юрий Александрович (чл.- корр. РАН, д.х.н., руководитель научно-производственного комплекса, главный метролог, Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет», Москва)*

[Презентация](#)

Л32. ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ. *Васильев Александр Леонидович (к.ф.-м.н, руководитель Агентства Нанотехнологий и Наноматериалов, РНЦ «Курчатовский институт», Москва)*

[Презентация](#)

Л33. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАНОСТРУКТУРНЫЕ ПЛЕНКИ И ПОКРЫТИЯ. ПОЛУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ ИХ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ. *Левашов Евгений Александрович (д.т.н., профессор, заведующий кафедрой порошковой металлургии и функциональных покрытий, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва)*

[Презентация](#)

Л34. АНАЛИЗ СПЕКТРОВ РЕНТГЕНОВСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ - НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТРЕХМЕРНОЙ АТОМНОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ НАНОМАТЕРИАЛОВ. *Солдатов Александр*

Владимирович (д.ф.-м.н., профессор, директор НОЦ «Наноразмерная структура вещества», Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)

[Презентация](#)

Л35. ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. *Левин Александр Давидович (д.т.н., ведущий научный сотрудник, ФГУП «ВНИИОФИ», Москва)*

[Презентация](#)

Л36. ЭЛЕКТРОННАЯ ТОМОГРАФИЯ СЛОИСТЫХ НАНОСТРУКТУР. *Рау Эдуард Иванович (д.ф.-м.н., профессор, в.н.с., Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, Черноголовка)*

[Презентация](#)

Л37. ПРОСВЕЧИВАЮЩАЯ И РАСТРОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ: НАНОДИАГНОСТИКА И НАНОМЕТРОЛОГИЯ ОБЪЕМНЫХ И ПОРОШКОВ МАТЕРИАЛОВ. *Пушин Владимир Григорьевич (д.ф.-м.н., профессор, зав. лабораторией, Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург)*

[Презентация](#)